



Gdańsk, dnia 25.10.2012 r.

ZP/338/D/050/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „*dostawa wielozadaniowej aparatury ultrawysokopróżniowej przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw i układów wielowarstwowych metodą PVD modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z rodziny spektroskopii fotoelektronów PES oraz mikroskopii skaningowej SPM w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej*”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

- 1. Pytanie:** *Zamawiający w Załącznik nr 7. Do SIWZ pkt 1 „Moduł Analityczny Spektroskopii Fotoelektronów XPS p. pkt 2 „Komora załadowcza” ustanowił m. in. następujące wymaganie: Przenoszenie próbki ma być przeprowadzane z użyciem szyny transportowej ze sprzężeniem magnetycznym. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szyny mechanicznej w Module transferu do transportu próbki pomiędzy komorą załadowczą komory analizy. Takie rozwiązanie cechuje się ogromną łatwością obsługi oraz dużą dokładnością i powtarzalnością.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający zmienia tym samym treść SIWZ.

- 2. Pytanie:** *Zamawiający w Załącznik nr 7. Do SIWZ pkt 1. Moduł Analityczny Spektroskopii Fotoelektronów XPS” p. pkt. 2 „Komora załadowcza: ustanowił m. in. następujące wymaganie: komora załadowcza musi być pompowana przez główną pompę turbo za pośrednictwem układu typu by-pass. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie samodzielnego układu pompowania dla komody załadowczej?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający zmienia tym samym treść SIWZ.

- 3. Pytanie:** *Zamawiający w Załącznik nr 7. DO SIWZ pkt. 1 „Moduł Analityczny Spektroskopii Fotoelektronów XPS p. pkt. 2” „Komora załadowcza” ustanowił m. in. następujące wymaganie: Komora musi być wyposażona w drzwi umożliwiające szybki dostęp do wnętrza aparatury. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dedykowanej pokrywki z mechanizmem do komory załadowczej. Umożliwia ona szybki i łatwy sposób ładowania próbek.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający zmienia tym samym treść SIWZ.

- 4. Pytanie:** *Zamawiający w Załącznik nr 7. Do SIWZ pkt. 1. „Moduł Analityczny Spektroskopii Fotoelektronów XPS” ustanowił min. następujące wymaganie: P. pkt. 10. Źródła jonów z możliwością precyzyjnego skupiania wiązki do trawienia powierzchni i neutralizacji ładunków” Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch niezależnych urządzeń:*

- a) *Źródła jonów z możliwością precyzyjnego skupiania wiązki do trawienia powierzchni o specyfikacji:*



- Rozmiar plamki poniżej 150 mikrometrów
 - Gęstość prądu powyżej 2 mA/cm² przy napięciu wiązki 5 kV
 - Pełne sterowanie źródłem za pomocą komputera
 - Zakres skanowania powierzchni co najmniej 8mm x 8 mm.
 - Doprowadzenie gazu za pomocą regulowanego zaworu dozującego.
 - Układ pompowania różnicowego z pompą turbo o wydajności co najmniej 1/s i pompą rotacyjną.
- b) Źródła do neutralizacji ładunków o specyfikacji:
- Wartość prądu zapewniającego wydajną neutralizację Ładunki w metodach XPS I AES przy niskich energiach wiązki rzędu 10 eV.
 - Sterowanie źródłem za pomocą komputera.
- Urządzenia te w pełni pokrywają specyfikację Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści dwa niezależne urządzenia tj. źródła jonowego do trawienia i źródła elektronowego do neutralizacji ładunków – pełne brzmienie – Informacja o zmianie treści SIWZ.

5. **Pytanie:** Zamawiający w Załącznik nr 7. Do SIWZ pkt. 3 „Moduł Wzrostu Warstw PVD” p. pkt. 9 „komputer i moduł kontroli procesu” ustanowił m. in. następujące wymaganie: Wymagane jest oprogramowanie kontroli procesu pracujące w środowisku LabView... Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania modułowego umożliwiającego realizację kontroli procesu w środowisku LabView.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga oprogramowania kontroli procesu pracującego w środowisku LabView.

6. **Pytanie:** Załącznik nr 5 do SIWZ „Umowa” 4. „Warunki gwarancji” ust. 4 ustanowił m.in. następujące wymaganie: Świadczenia gwarancyjne wykonywane w miejscu realizacji zamówienia wskazanym w 3 ust. 3 Umowy. Niektóre prace mogą wymagać użycia specjalistycznego sprzętu w związku z czym prace muszą być wykonane w siedzibie Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu: „a w szczególnych przypadkach, jeżeli jest to konieczne, w siedzibie Wykonawcy? Dodatkowo wskazany w 3 ust. 3 Umowy nie mówi o miejscu realizacji zamówienia. W związku z tym, czy można uznać to za omyłkę pisarską i założyć, iż prawidłowy zapis powinien wskazywać 3 ust. 2 Umowy?

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 5 do SIWZ- wzór umowy.

7. **Pytanie:** Załącznik nr 5 do SIWZ „Umowa” 4 „Warunki gwarancji” ust. 3 ustanowił min. następujące wymaganie: W przypadku awarii przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 30 dni liczonych od powiadomienia Wykonawcy o awarii. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń gwarancyjnych. Niektóre prace mogą wymagać ściągnięcia podzespołów od poddostawców. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu: „W uzasadnionych przypadkach jeżeli jest to konieczne, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu usunięcia wad o czas potrzebny na dostarczenie podzespołów od podwykonawców”.

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 5 do SIWZ- wzór umowy



8. **Pytanie:** Załącznik nr 5 do SIWZ „Umowa” 6 „Kary Umowne” ust. 1. ustanowił m.in. następujące wymaganie: Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy oraz w usuwaniu wad.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na „Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają odszkodowanie w formie kar umownych:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu całości przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% ceny umownej netto,

b) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi liczonego od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wady Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości Umowy.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia netto..”

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 5 do SIWZ- wzór umowy.

9. **Pytanie:** Pragniemy złożyć zapytanie odnośnie postępowania nr ZP/338/050/D/12, Załącznik 7 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Czy zamawiający zgadza się na następujące alternatywne rozwiązanie w stosunku do wyspecyfikowanego? W rozdziale 1. Moduł Analityczny Spektroskopii Fotoelektronów XPS, w p. 8 tabeli, tj. Źródło promieniowania rentgenowskiego z monochromatorem jest napisane: Monochromator powinien umożliwiać zamontowanie co najmniej siedmiu kryształów. Wszystkie kryształy muszą posiadać stabilizację lub kompensację temperatury w celu uniknięcia rozmycia energii. Firma xxxxx oferuje inną konstrukcję monochromatycznego źródła promieniowania rentgenowskiego. Nasze źródło zawiera 4 kryształy ze znikomą małą „przestrzenią martwą”, zamocowanie na wspólnej płaszczyźnie i ustanawiane za pomocą pojedynczego precyzyjnego mechanizmu o wysokiej niezawodności, który wymaga bardzo rzadkiej, sporadycznej ponownej adjustacji. Konstrukcja źródła i zastosowane materiały są dobrane w sposób zapewniający samokompensację, tzn. współczynniki rozszerzalności cieplnej materiałów wzajemnie się kompensują, 4 kryształy są bezpośrednio sprzężone ze sobą, a płaszczyzna nośna ma dużą masę. W oparciu o naszą wiedzę opis zestawu z siedmioma kryształami jest opisem konstrukcji a nie kryterium związanym z wydajnością i parametrami użytkowymi. W związku z tym mamy nadzieję, że nasze rozwiązanie zostanie przyjęte.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SIWZ dopuszczając każde rozwiązanie, które za pomocą min. jednego kryształu osiągnie wymagane parametry - pełne brzmienie – Informacja o zmianie treści SIWZ.

10. **Pytanie:** W komorze wzrostu warstw PVD Zamawiający wymaga, aby mieściła się próbka o średnicy 2 cali. Jakie są wymagane maksymalne wymiary próbki dla pozostałych modułów (XPS i STM)?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SIWZ, pozostałe moduły (XPS i STM) muszą mieścić próbki o takich samych rozmiarach jak komora wzrostu warstw PVD – pełne brzmienie – Informacja o zmianie treści SIWZ.

11. **Pytanie:** Dotyczy modułu XPS (punkt 8): czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monochromatora z jednym dużym kryształem zamiast siedmiu jeżeli parametry zaoferowane z jednym dużym kryształem nie będą gorsze od wymaganych (w niektórych przypadkach nawet lepsze)? Dodatkową zaletą będzie wówczas łatwiejsze osiowanie układu.

Odpowiedź: Odpowiedź udzielona przy pytaniu nr 9.



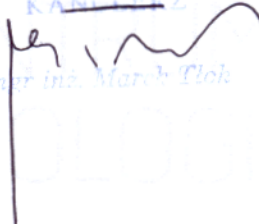
12. **Pytanie:** *Dotyczy moduły XPS (punkt 10): Zamawiający wymaga źródła jonów do trawienia i neutralizacji ładunku. Zazwyczaj do neutralizacji ładunku wymagane jest źródło elektronów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kombinacji źródła jonowego do trawienia i źródła elektronowego do neutralizacji ładunków?*

Odpowiedź: Odpowiedź udzielona przy pytaniu nr 4.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 uPzp, prowadzą także do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

**(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)**

KANCELERZ

mgr inż. Marek Ciolek

**CENTRUM NANOTECHNOLOGII
Politechniki Gdańskiej**